

NORME INTERNATIONALE

Cristaux de tantalate de lithium et de niobate de lithium pour applications utilisant des dispositifs à ondes acoustiques de surface (OAS) - Spécifications et méthodes de mesure

Document Preview

IEC 63541:2025

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/62be4d7f-6854-4524-9475-90194a353545/iec-63541-2025>



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED
Copyright © 2025 IEC, Geneva, Switzerland

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Secretariat
3, rue de Varembé
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Recherche de publications IEC -

webstore.iec.ch/advsearchform

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études, ...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et une fois par mois par email.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: sales@iec.ch.

IEC Products & Services Portal - products.iec.ch

Découvrez notre puissant moteur de recherche et consultez gratuitement tous les aperçus des publications, symboles graphiques et le glossaire. Avec un abonnement, vous aurez toujours accès à un contenu à jour adapté à vos besoins.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire d'électrotechnologie en ligne au monde, avec plus de 22 500 articles terminologiques en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 25 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

[IEC 63541:2025](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/62be4d7f-6854-4524-9475-90194a353545/iec-63541-2025)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/62be4d7f-6854-4524-9475-90194a353545/iec-63541-2025>

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	3
1 Domaine d'application.....	5
2 Références normatives	5
3 Termes et définitions	5
4 Exigences	7
4.1 Spécifications des matériaux	7
4.1.1 LN	7
4.1.2 LT.....	7
4.2 Exigences pour le cristal cultivé.....	7
4.2.1 Spécifications	7
4.2.2 Qualité macroscopique.....	8
4.2.3 Domaine unique	8
4.2.4 Température de Curie et tolérance	8
4.2.5 Paramètre de réseau.....	8
4.3 Exigences relatives au cristal lumbéré	8
4.3.1 Cristal brut pour cristal lumbéré.....	8
4.3.2 Spécifications	8
5 Échantillonnage et contrôle.....	9
5.1 Généralités	9
5.2 Plan d'échantillonnage et de contrôle	9
5.3 Détermination des résultats d'inspection	10
6 Méthodes d'essais	10
6.1 Méthodes d'essai pour les cristaux bruts.....	10
6.1.1 Diamètre et longueur du cylindre	10
6.1.2 Qualité macroscopique.....	10
6.1.3 Domaine unique	10
6.1.4 Température de Curie	10
6.1.5 Paramètre de réseau.....	10
6.2 Méthodes d'essai pour le cristal lumbéré	11
6.2.1 Orientation de la surface	11
6.2.2 Diamètre.....	11
6.2.3 Orientation du plat d'orientation.....	11
6.2.4 Largeur du plat d'orientation.....	11
6.2.5 Longueur effective	11
6.2.6 Cylindricité.....	11
6.2.7 Verticalité	11
7 Identification, étiquetage, emballage, conditions de livraison	11
7.1 Emballage.....	11
7.2 Étiquetage et identification	11
7.3 Modalités de livraison.....	11
Annexe A (normative) Mesure du domaine unique pour les cristaux LT et LN	12
A.1 Généralités	12
A.2 Principe de mesure	12
A.3 Mesure	12
A.3.1 Méthode du chemin de lumière diffusée.....	12
A.3.2 Méthode de gravure	13

A.3.3	Méthode par tension électromotrice	15
Annexe B (normative)	Mesure de la température de Curie	17
B.1	Généralités	17
B.2	Méthode d'analyse thermique différentielle	17
B.3	Méthode DSC	18
B.4	Méthode de la constante diélectrique.....	18
Annexe C (normative)	Mesure du paramètre de réseau (méthode de Bond)	20
Annexe D (normative)	Mesure de la cylindricité pour les cristaux LT et LN	22
D.1	Généralités	22
D.2	Mesure	22
D.2.1	Appareil	22
D.2.2	Procédure de mesure.....	22
D.2.3	Autres instructions	23
Annexe E (normative)	Mesure de verticalité pour les cristaux LT et LN.....	24
E.1	Généralités	24
E.2	Mesure	24
E.2.1	Appareil	24
E.2.2	Procédure de mesure.....	24
Bibliographie		25
Figure 1	– Schéma de principe du cristal lumbéré.....	6
Figure 2	– Schéma de verticalité du cristal lumbéré.....	7
Figure A.1	– Schéma de principe de la position de l'échantillon.....	14
Figure A.2	– Schéma de principe des points de mesure.....	14
Figure A.3	– SExemples de 42°Y-X LT après gravure.....	15
Figure A.4	– SExemples de LN 128°Y-X après gravure.....	15
Figure A.5	– Schéma de forme d'onde des cristaux mono-domaine.....	16
Figure A.6	– Schéma de forme d'onde pour les cristaux non mono-domaine.....	16
Figure B.1	– Schéma d'un système DTA.....	17
Figure B.2	– Schéma d'un système DSC	18
Figure B.3	– Schéma d'un système de mesure de constante diélectrique	19
Figure C.1	– Laméthode obligatoire.....	21
Figure D.1	– Schéma de principe de mesure de la cylindricité.....	22
Figure E.1	– Schéma de principe de mesure de la verticalité	24
Tableau 1	– Caractéristiques types du cristal cultivé.....	8
Tableau 2	– La valeur centrale et la tolérance de la spécification de température de Curie	8
Tableau 3	– Spécifications types du cristal lumbéré.....	9
Tableau 4	– Plan d'échantillonnage et de contrôle	10

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Cristaux de tantalate de lithium et de niobate de lithium pour applications utilisant des dispositifs à ondes acoustiques de surface (OAS) - Spécifications et méthodes de mesure

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'IEC attire l'attention sur le fait que la mise en application du présent document peut entraîner l'utilisation d'un ou de plusieurs brevets. L'IEC ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et à l'applicabilité de tout droit de brevet revendiqué à cet égard. À la date de publication du présent document, l'IEC n'avait pas reçu notification qu'un ou plusieurs brevets pouvaient être nécessaires à sa mise en application. Toutefois, il y a lieu d'avertir les responsables de la mise en application du présent document que des informations plus récentes sont susceptibles de figurer dans la base de données de brevets, disponible à l'adresse <https://patents.iec.ch>. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'IEC 63541 a été établie par le comité d'études 49 de l'IEC: Dispositifs piézoélectriques, diélectriques et électrostatiques et matériaux associés pour la détection, le choix et la commande de la fréquence. Il s'agit d'une Norme internationale.